

CARACTERISATION DE SYSTEMES RFID (ou METROLOGIE APPLIQUEE AUX DISPOSITIFS SANS CONTACT)

Objectif - Compétences acquises :

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de : • Comprendre les fondamentaux nécessaires à la métrologie appliquée aux systèmes sans contact. • Appréhender les différentes techniques de caractérisation d'un système RFID UHF Formation basée sur des travaux pratiques. Elle se compose de 3 ateliers tournant de 2 heures précédés par un bref rappel de cours.

Public concerné :

- Académique
- Industriel

Durée :

- 1 jours

Date/lieux :

- Nous consulter
- Non défini

Equipe pédagogique :

- Spécialiste du domaine

Approche pédagogique :

- Alternance de cours et de travaux pratiques

Renseignement pédagogique :

- PANNIER Philippe
- philippe.pannier@univ-amu.fr

Frais de participation individuels :

- 1500 € HT

Renseignements et inscriptions :

- Inscription : Formation Professionnelle Continue d'Aix- Marseille Université
- Tél : +33(0) 4 42 60 43 04
- Fax : +33(0) 4 42 60 43 04
- Email : fpc-entreprises@univ-amu.fr
- Date limite d'inscription : 1 mois avant

Nombre de places limitées :

- Min/Max : 2 à 6 personnes

Prérequis :

- Connaissance préalable en systèmes RFID (bases) ou avoir suivi la formation "Systèmes RFID (bases)"

Programme :

- Point d'introduction aux manipulations (1h, Groupe entier) :
 - Rappels de cours
 - Présentation des manipulations
- Mesure Oscilloscope (2h, 2 personnes) :
 - Etude des principales caractéristiques des oscilloscopes (trigger, voie d'échantillonnage, FFT)
 - Comparatif mesure avec sonde (passive et active)
 - Application aux caractéristiques de signaux NFC
- Mesure VNA (2h, 2 personnes) :
 - Introduction au principe de fonctionnement d'un VNA
 - Méthodologie de mesure via VNA
 - Application à l'adaptation d'une antenne lecteur NFC
- Mesure analyseur de spectre (2h, 2 personnes) :
 - Principe de fonctionnement d'un analyseur de spectre
 - Méthodologie de mesure via d'un analyseur de spectre
 - Caractérisation de dispositifs actifs

Validation :

Cette formation constitue une action d'adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de participation. Une évaluation de fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment concernant l'atteinte des objectifs pédagogiques.